



光子学报 » 2013, Vol. 42 » Issue (7): 817-822 DOI: 10.3788/gzxb20134207.0817

[薄膜光学](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

基底和膜层-基底系统的赝布儒斯特角计算

刘华松¹, 姜玉刚^{1,2}, 王利栓¹, 姜承慧¹, 季一勤^{1,3}

1. 天津航技术物理研究所 天津市薄膜光学重点实验室, 天津 300192;
2. 同济大学 物理系 先进微结构材料教育部重点实验室, 上海 200092;
3. 哈尔滨工业大学 光电子技术研究所 可调谐激光技术国家级重点实验室, 哈尔滨 150080

Calculation of Pseudo-brewster Angle for Substrate and Thin Film-substrate System

LIU Hua-song¹, JIANG Yu-gang^{1,2}, WANG Li-shuan¹, JIANG Cheng-hui¹, JI Yi-qin^{1,3}

1. Tianjin Key Laboratory of Optical Thin Film, Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics, Tianjin 300192, China;
2. Key Laboratory of Advanced Micro-Structure Materials(Ministry of Education), Department of Physics, Tongji University, Shanghai 200092, China;
3. National Key Laboratory of Science and Technology on Tunable Laser, Institute of Optical-electronics, Harbin Institute of Technology, Harbin 150080, China